

平成30年1月10日

入庁時の所持品検査の実施等について（お知らせ）

横浜地方裁判所

横浜地方裁判所，横浜簡易裁判所，横浜第一検察審査会，横浜第二検察審査会及び横浜第三検察審査会の庁舎（以下「本庁舎」といいます。）においては，来庁者の皆様の安全確保のため，平成30年3月1日から，入庁時にゲート式の金属探知機等を用いた所持品検査を実施することとなりました。また，これに伴い，現在入退庁の際に御利用いただいている出入口のうち「みなと大通り」側の出入口を閉鎖するため，本庁舎の出入口は「日本大通り」側の出入口のみとなります。

つきましては，本庁舎を御利用の際には，お時間に余裕を持ってお越しいただきますようお願いいたします。

なお，「みなと大通り」側の駐車場については，これまでどおり御利用いただくことができますが，入庁される際に「日本大通り」側の出入口を御利用いただくこととなります（下図の点線を御参照ください。なお，駐車場の台数に限りがございますので，できる限り公共交通機関を御利用ください。）。

本庁舎を御利用される皆様には，大変御不便をお掛けし申し訳ありませんが，御理解，御協力いただきますようお願い申し上げます。

